

技術分類 機器分析(材料)

キーワード FT-IR, ラマン, XRF, XRD, 热分析, SEM

ID	技術分類	能力	スキル種類	資格・修了書等	スキル達成条件
RJB001	機器分析(材料系)	分析機器スキル(粉末X線)	技		<p>【初級】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・装置やデータ処理ソフトウェアの操作マニュアルに則り、測定を行うことができる ・測定に適した粒度の結晶性粉末に適宜粉碎加工できる ・良質なデータが得られるように、測定に適した量、形態でサンプルホルダーにセットすることができる ・装置やデータ処理ソフトウェアの操作マニュアルに則り、測定を行うことができる ・良質なデータが得られるように、基本的な測定条件を適宜変更することができます ・データベース検索ソフトウェアを活用しながら、サンプルに含まれる結晶性成分の候補を調べ、X線回折ピークの帰属ができる <p>【中級】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・XRFなどの他の元素分析結果と比較しながら、データベース検索により得られた結晶性成分の候補の妥当性を評価できる ・学生等のユーザーに対し、粉末X線回折装置の利用やデータ処理・解析の講習会を実施することができます ・装置メーカーの指導の元、初步的な消耗品交換ができる(X線管球など) ・リートベルト解析専用ソフトウェアの基本的な操作ができる ・リートベルト解析により、簡単な組成分析ができる ・依頼者の研究ニーズを汲み取った依頼分析報告書を作成することができます <p>【上級】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リートベルト解析により、複雑な組成分析ができる ・リートベルト解析により、粉末結晶構造解析ができる
RJB003	機器分析(材料系)	分析機器スキル(顕微ラマン)	技		<p>【初級】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンプルの形態に合わせた前処理加工を行うことができる ・正立顕微鏡でサンプルを適切に観察することができます ・装置やデータ処理ソフトウェアの操作マニュアルに則り、測定を行うことができる ・良質なデータが得られるように、基本的な測定条件を適宜変更することができます ・データベース検索ソフトウェアを活用しながら、サンプルに含まれる既知成分の候補を調べ、ラマンバンドの帰属ができる <p>【中級】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・XRFやFT-IRなどの他の機器分析結果と比較しながら、データベース検索により得られた成分の候補の妥当性を評価できる ・測定結果の品質を考慮した上で、独自のラマンスペクトル検索用データベースを構築することができます ・学生等のユーザーに対し、粉末X線回折装置の利用やデータ処理・解析の講習会を実施することができます ・シングルラマンスペクトルやマッピング測定結果に対し、多成分分離解析ができる ・装置メーカーの指導の元、初步的なユーザートラブル対応ができる